

FAISCEAU IONIQUÉ FOCALISÉ (FIB)

FABRICANT: Hitachi

MODÈLE : FB 2000-A

Échantillons

- Grandeur des régions observées : maximum 254 mm x 254 mm (10" x 10")
- Dédie à la préparation de lames minces d'échantillons pour l'analyse subséquente au microscope électronique à transmission (TEM)
- Types de matériaux : métaux, céramiques, polymères, composites, etc.

Caractéristiques

- Muni d'un canon de tungstène pour dépôt
- Muni d'un micromanipulateur pour extraction de lames minces